用光致发光研究不同通量辐照磷酸 二氢钾晶体的缺陷^{*}

李香草 刘宝安 李猛 闫春燕 任杰 刘畅 巨新†

(北京科技大学数理学院,北京 100083)

(2020年4月1日收到; 2020年5月19日收到修改稿)

磷酸二氢钾晶体中的缺陷对晶体的激光诱导损伤起着重要作用.晶体的激光诱导损伤限制了大功率激 光系统的发展.本文用真空紫外光致发光发射谱研究了不同通量辐照下磷酸二氢钾晶体的缺陷.与 11.5 J/cm²辐照下的晶体及退役元件相比,9 J/cm²辐照下晶体的荧光谱中在 231.55 nm 处出现了一个新峰. 它可能源于自捕获激子的辐照湮灭.9.0 J/cm²辐照晶体中主要是短链结构,而退役元件的损伤较复杂,有短 链、中链和长链结构.短链中的 P—O 键比长链中的短,磷的 3s 轨道与氧的 2p 轨道重叠增加,则自捕获激子 的辐照湮灭增强.结果显示出退役元件与 9 J/cm²辐照下晶体的结构不同.对研究磷酸二氢钾晶体的激光诱 导损伤机制有重要意义.

关键词:磷酸二氢钾晶体,缺陷,光致发光 PACS: 42.70.Mp, 61.72.-y, 78.55.-m

DOI: 10.7498/aps.69.20200482

1 引 言

在高功率系统中如国家点火装置,磷酸二氢 钾 (potassium dihydrogen phosphate, KDP) 晶体 一般用于电光转换和频率转换^[1-3]. 但是 KDP 晶体的激光诱导损伤限制了激光系统的光强,它吸引 了大批研究者的关注^[4,5].

激光诱导损伤源于晶体中一些杂质或者缺陷 的光吸收^[1,6-10]. 晶体中的杂质和缺陷一般来自于 晶体的生长及加工过程^[11-14]. Pommiès 等^[15] 用光 热探测器和荧光光谱研究了损伤前驱体, 他们发现 金属杂质在激光诱导损伤过程中起着重要作用. 聚 集的金属包裹体具有较高的吸收系数和热导率, 它 们在激光诱导损伤过程中起着损伤前驱的作用^[16-18]. KDP 晶体中的缺陷一般和 H₂PO₄-基团相关, 很多 学者研究了 KDP 晶体中 A 和 B 基, 它们主要是 由晶体中的氢键引起的. Duchateau 等^[19]的研 究显示出在飞秒激光辐照下 KDP 和 DKDP 晶 体在 800 nm 处出现 B 基和自捕获激子缺陷, 在 266 nm 处则显示出 A 和 B 基^[20]. 虽然很多学者研 究了 KDP 晶体中的缺陷, 但是对高低通量下 KDP 晶体中缺陷变化的研究还不够.

同步辐射是一种具有高灵敏度的检测技术,用 真空紫外光谱 (vacuum ultraviolet, VUV)可以得 到 KDP 晶体微观结构变化.本文用 VUV 光谱研 究了不同通量下 KDP 晶体的缺陷,对比了退役元 件与高通量辐照下 KDP 晶体荧光光谱特征.文章 的第二部分是样品及实验信息,第三部分是实验的 结果及分析讨论,第四部分是总结.这项研究显示 了退役元件与高通量辐照下晶体中的缺陷是不 同的.

^{*} 国家自然科学基金 (批准号: 51402173) 和中央高校基本科研业务费专项资金 (批准号: FRF-TP-15-099A1) 资助的课题.

[†] 通信作者. E-mail: jux@ustb.edu.cn

^{© 2020} 中国物理学会 Chinese Physical Society

2 实验参数

一部分样品是退役元件,通过慢生长法生长, 原晶体尺寸为 300 mm × 300 mm × 10 mm,实 验所用样品是从原晶体中切下的三块 20 mm × 10 mm × 1 mm 的薄片.退役元件经过了 400 个 脉冲辐照,其中激光波长为 355 nm,半高宽为 1 ns.激光通量最大值为 1.8 J/cm²,平均通量为 1.2 J/cm².另一部分样品用慢生长法生长,通过单 点金刚石飞切技术加工为 10 mm × 10 mm × 1 mm.用不同激光通量辐照 KDP 晶体形成损伤 点,激光波长为 355 nm,半高宽和频率分别为 6.8 ns 和 1 Hz.激光在样品表面的光斑大小为 0.22 mm²,详细的样品及激光参数可参考文献 [21].

在北京同步辐射 4 B8 线站进行 VUV 实验. 同步加速器的能量为 2.5 GeV, 电流范围为 60—150 mA, 光斑为 1 mm × 2 mm, 1 m 的 Seya 单色仪 (1200 g/mm, 120—450 nm, 1 nm)和 Acton SP-308 单色仪 (600 g/mm, 330—900 nm)用于测 试发射谱,激光激发波长为 155 nm. 样品腔中的真 空度为 1 × 10⁻⁵ mbar. 每个 KDP 样品分别测试 了 200—400 nm 和 400—800 nm 范围的发射谱, 步长为 1 nm, 时间间隔为 3 s, 用 Hamamatsu H8259-01 光子计数探测信号.

3 结果与讨论

图 1显示了不同通量辐照下 KDP 晶体的光 致 发 光 (photoluminescence, PL)发 射 谱. 在 400—800 nm 范围内有一个宽带,这个波段的中心 位置是 477 nm. 高能量边的范围为 200—400 nm, 9.0 J/cm² 辐照样品的中心位置是 232 nm, 而退役 元件与 11.5 J/cm² 辐照样品的中心位置为 269 nm. 从图 1 中可以看出, 9.0 J/cm² 辐照下 KDP 晶体 的光谱中有一个强峰.不同通量辐照下 KDP 晶体的发射谱拟合如图 2 和图 3 所示,每个高斯峰代表了一种缺陷.

表1列出了对应于图2的高斯拟合参数,当前 的拟合可以很好地分析发射谱.从图2可以看出, 不同通量辐照下晶体光谱的峰型和峰位相似,在 400—800 nm 波长范围内有三个峰,分别为A, B和C,这些峰源自不同的缺陷.

Müller^[22]用电子顺磁共振及光谱研究了 KDP 晶体的本征缺陷, KDP 晶体中最常见的缺陷 有两种:空位 (L缺陷)和双占有氢键 (D缺陷).在 晶体生长过程中会引入大量 L缺陷,晶体中的



图 1 不同通量辐照下 KDP 晶体的 PL 发射谱, 测量能量 范围为 (a) 200—400 nm; (b) 400—800 nm

Fig. 1. PL emission spectra of KDP crystal with different flux irradiations measured from (a) 200 to 400 nm and (b) 400 to 800 nm.

表 1 400—800 nm 范围内不同通量辐照下 KDP 晶体 PL 发射谱的高斯拟合参数 Table 1. Parameters of peaks with Gaussian fitting for samples irradiated by different flux irradiations measured from 400 to 800 nm.

Peak ·	Position/nm			Area/arb. units.			FWHM/nm		
	Retired	$9.0 \ \mathrm{J/cm^2}$	11.5 J/cm^2	Retired	$9.0 \mathrm{~J/cm^2}$	$11.5 \mathrm{~J/cm^2}$	Retired	$9.0 \ \mathrm{J/cm^2}$	$11.5 \mathrm{~J/cm^2}$
А	420.27	430.52	423.87	0.12	0.35	0.13	15.38	45.14	19.41
В	479.19	480.94	480.54	2.23	1.50	1.12	88.95	91.53	80.68
С	587.24	578.64	593.58	2.40	1.68	2.51	116.60	140.89	122.17



图 2 400—800 nm 范围内不同通量辐照下 KDP 晶体的 PL 发射谱 (a) 退役元件; (b) 9.0 J/cm²; (c) 11.5 J/cm². 黑色线是实验光谱, 红线是拟合叠加谱, 蓝线为高斯拟合曲线

Fig. 2. PL emission spectra of KDP crystals with different flux irradiations measured from 400 to 800 nm: (a) Retired; (b) 9.0 J/cm²; (c) 11.5 J/cm². The black solid lines represent the experiment spectra, the red dotted lines represent the simulated spectra, and the blue lines represent the Gaussian fitting curve.

A 基是由 H₂PO₄⁻失去一个质子引起的, 它是一个空 穴捕获中心. A 基的形成方式一般有两种: 一种方 式与 L 缺陷有关, 即 L + h⁺ → L⁺ \equiv A; 另一种 方式为辐照空穴, Setzler 和 Halliburton^[23] 通过电 子顺磁共振研究认为 A 基浓度与中性氢原子有关. 氢离子捕获一个电子后转变成一个中性氢原子, 氢 原子从正常晶格中排出, 与空位最邻近的氧原子捕



图 3 200—400 nm 范围内不同通量辐照下 KDP 晶体的 PL 发射谱 (a) 退役原件; (b) 9.0 J/m²; (c) 11.5 J/m². 图中黑色线是实验光谱, 红线是拟合叠加谱, 蓝线为高斯 拟合曲线

Fig. 3. PL emission spectra of KDP crystals with different fluxirradiations were measured from 200 to 400 nm: (a) Retired; (b) 9.0 J/m²; (c) 11.5 J/m². The black solid lines represent the experiment spectra, the red dotted lines represent the simulated spectra and blue lines represent the Gaussian fitting curve.

获一个空穴然后形成 A 基. 中性氢原子处于自由 位置会形成H₃PO₄基团 (D 缺陷)^[24]. 间隙氢离子 是 KDP 晶体中最常见的电子捕获中心.

很多学者研究了磷酸玻璃的辐照诱导缺陷, 400—800 nm 范围内的 PL 带一般是由激光诱导 损伤点的缺陷引起的^[25-27]. 从图 2 可以看出, 不同 通量辐照下 KDP 晶体的缺陷种类相同, 文献中已

表 2 200—400 nm 范围内不同通量辐照下 KDP 晶体 PL 发射谱的高斯拟合参数 Table 2. Parameters of peaks with Gaussian fitting for samples irradiated by different flux irradiations measured from 200 to 400 nm.

Peak	Position/nm			Area/arb. units			FWHM/nm		
	Retired	$9.0 \ \mathrm{J/cm^2}$	$11.5 \mathrm{~J/cm^2}$	Retired	$9.0 \mathrm{~J/cm^2}$	$11.5 \mathrm{~J/cm^2}$	Retired	$9.0 \mathrm{~J/cm^2}$	$11.5 \mathrm{~J/cm^2}$
А	231.55			2.00			32.89		
В	268.01	269.61	269.04	3.33	2.26	2.29	71.66	62.61	67.12
\mathbf{C}	324.02	326.95	326.82	2.67	1.94	1.35	91.90	83.30	79.92

给出这些 PL 带对应的缺陷. 如 Chiodini 等^[28] 认为 420 nm 荧光带是由氧缺陷中心 (ODCs) 引起的. 479.19 nm PL 带源于 L 缺陷, 其在 KDP 晶体的光吸收中起着重要的作用. 587.24 nm PL 带则源于磷氧空穴. 表 1 和表 2 列出了高斯拟合的光谱参数,可以看出发射谱是由几个重叠的高斯峰组成.

图 3显示出晶体在高能量边具有相似的荧光 性质,表 2 给出了对应于图 3 的每个高斯峰参数. 从图 3 可以看出,9.0 J/cm² 辐照下晶体的荧光谱 在 231.55 nm 处出现了一个新峰.根据 Ogorodnikov 等^[29]的研究可知,236 nm 处的本征荧光带是由自 捕获激子的辐照湮灭引起的.从图 3 可以看出每个 光谱都存在 B 和 C 峰的叠加.Ogorodnikov 和 Shul'gin^[30]认为 260 nm 处的荧光带是由自捕获激 子的辐照衰减引起的.Chiodini 等^[28]认为 SiO₂ 光 致发光谱中的 326 nm 荧光带是由 ODCs 引起的. 因此,推测图 3 中的 C 峰源于 KDP 晶体损伤区的 氧缺陷中心.

在居里温度 ($T_c = 123$ K) 以下, KDP 晶体荧 光带中的 236 nm 主要是由 H_2PO_4 基团引起的. 根据之前的研究结果^[21], 9.0 J/cm² 辐照晶体中主 要是短链结构, 而 11.5 J/cm² 辐照晶体中主要是 中链结构, 退役元件的损伤较复杂, 有短链、中链 和长链结构. 短链中的 P—O 键比长链中的短, 磷 的 3s 轨道与氧的 2p 轨道重叠增加, 则自捕获激子 的辐照湮灭增强. 因此, 9.0 J/cm² 辐照晶体中出 现 231.55 nm 荧光带, 说明退役元件中的缺陷与 9.0 J/cm² 辐照晶体中的缺陷不同.

4 结 论

用真空紫外光致发光谱研究不同通量辐照 下 KDP 晶体的缺陷,揭示了 KDP 晶体中不同 损伤点荧光带的起因.9.0 J/cm² 辐照晶体中的 231.55 nm 荧光带源于自捕获激子的辐照湮灭. 这显示出退役元件中的缺陷与 9.0 J/cm² 辐照晶体中的缺陷不同. 本工作对 KDP 晶体中的缺陷有了更深层次的理解.

参考文献

- Carr C W, Radousky H B, Demos S G 2003 *Phys. Rev. Lett.* 91 127402
- [2] Boopathi K, Rajesh P, Ramasamy P, Manyum P 2013 Opt. Mater. 35 954
- [3] De Yoreo J J, Burnham A K, Whitman P K 2002 Int. Mater. Rev. 47 113
- [4] Schmid A, Kelly P, Bräunlich P 1977 Phys. Rev. B 16 4569
- [5] Tien A C, Backus S, Kapteyn H, Murnane M, Mourou G 1999 Phys. Rev. Lett. 82 3883
- [6] Swain J, Stokowski S, Milam D, Rainer F 1982 Appl. Phys. Lett. 40 350
- [7] Yokotani A, Sasaki T, Yoshida K, Yamanaka T, Yamanaka C 1986 Appl. Phys. Lett. 48 1030
- [8] Singleton M F, Cooper J F, Andresen B D, Milanovich F P 1988 Appl. Phys. Lett. 52 857
- [9] Demos S G, Yan M, Staggs M, De Yoreo J J, Radousky H B 1998 Appl. Phys. Lett. 72 2367
- [10] Jiang H, McNary J, Tom H W K, Yan M, Radousky H B, Demos S G 2002 Appl. Phys. Lett. 81 3149
- [11] Demos S G, Staggs M, Radousky H B 2003 Phys. Rev. B 67 224102
- [12] Davis J E, Hughes R S, Lee H W H 1993 Chem. Phys. Lett. 207 540
- [13] Marshall C D 1994 J. Opt. Soc. Am. B: Opt. Phys. 11 774
- [14] Chirila M M, Garces N Y, Halliburton L E, Demos S G, Land T A, Radousky H B 2003 J. Appl. Phys. 94 6456
- [15] Pommiès M, Damiani D, Le Borgne X, Dujardin C, Surmin A, Birolleau J C, Pilon F, Bertussi B, Piombini H 2007 Opt. Commun. 275 372
- [16] Paul De Mange, Christopher W. Carr, Raluca A. Negres, 2008 J. Appl. Phys. 104 103103
- [17] Wang K, Fang C, Zhang J, Sun X, Wang S, Gu Q, Zhao X, Wang B 2006 J. Cryst. Growth 287 478
- [18] Paul De Mange R A N, Christopher W C 2006 Opt. Express 14 5313
- [19] Duchateau G, Geoffroy G, Dyan A, Piombini H, Guizard S 2011 Phys. Rev. B 83 075114
- [20] Duchateau G, Geoffroy G, Belsky A, Fedorov N, Martin P, Guizard S 2013 J. Phys Condens Matter 25 435501
- [21] Li X, Liu B A, Yan C, Liu C, Ju X 2018 Opt. Mater. Express 8 816
- [22] Müller K A 1987 Ferroelectrics 72 273

- [23] Setzler S D, Stevens K T, Halliburton L E 1998 Phys. Rev. B 57 2643
- [24] Harris L B, Vella G J 1973 J. Chem. Phys. 58 4550
- [25] Griscom D L, Friebele E J, Long K J, Fleming J W 1983 J. Appl. Phys. 54 3743
- [26] Archidi M E, Haddad M, Nadiri A 1996 Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 116 145
- [27] Ehrt D, Ebeling P, Natura U 2000 J. Non-Cryst. Solids 263 240
- [28] Chiodini N, Meinardi F, Morazzoni F, Paleari A, Scotti R, Di Martino D 2000 Appl. Phys. Lett. 76 3209
- [29] Ogorodnikov I N, Pustovarov V A, Cheremnykh V S 2003 Opt. Spectrosc. 95 385
- [30] Ogorodnikov I N, Shul'gin B V 2001 Opt. Spectrosc. 91 224

Photoluminescence spectrum study of defects of potassium dihydrogen phosphate crystals irradiated by different laser fluences^{*}

Li Xiang-Cao Liu Bao-An Li Meng Yan Chun-Yan

Ren Jie Liu Chang Ju Xin[†]

(School of Mathematics and Physics, University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083, China)

(Received 1 April 2020; revised manuscript received 19 May 2020)

Abstract

The laser-induced damage to potassium dihydrogen phosphate (KDP) crystal restricts the development of high power laser systems and attract the attention of researchers. The defects are essential for the understanding of the laser-induced damage to KDP crystals. The defects in KDP crystals are commonly related to $H_2PO_4^-$ groups. The defects of KDP crystal have been studied extensively, however the changes of defects of KDP crystal with low fluence and high fluence have not been investigated sufficiently. The synchrotron radiation technology is a sensitive method of detecting the defects. The vacuum ultraviolet photoluminescence (PL) emission spectra can provide microscopic structural changes in KDP crystals. In this work, we investigate the defects of KDP crystals irradiated with different fluences by vacuum ultraviolet PL emission spectra. The vacuum ultraviolet spectra are obtained at the 4B8 beam line in Beijing synchrotron radiation facilities. Each KDP crystal spectrum is measured from 200 to 400 nm and 400 to 800 nm. The emission spectra of KDP crystal irradiated with different fluences are fitted for illustration. Each Gaussian curve represents a kind of defect. Comparing the retired components with KDP crystal irradiated by 11.5 J/cm², the new band at 231.55 nm emerges in the spectra of KDP crystal irradiated by 9.0 J/cm^2 . The intrinsic luminescence band is assigned to the radiative annihilation of self-trapped excitons. According to our previous work, the short chain structures mainly exist in the crystal irradiated by 9.0 J/cm^2 , and the long chain structure is mainly in the crystal irradiated by 11.5 J/cm². The retired components have the short, medium and long chain. The length of P—O bond in the short chain is shorter than that in the long chain structure. The overlap between phosphorus 3sorbitals and oxygen 2p increases, and the radiative annihilation of STEs becomes stronger. So the band at 231.55 nm emerges in the spectrum of KDP crystal irradiated by 9.0 J/cm². It suggests that the structure of the retired component and the structure of KDP crystal irradiated by 9.0 J/cm^2 are different. The results provide an insight into the defects in KDP crystals. It is meaningful to study the mechanism of laser-induced damage to KDP crystal.

Keywords: potassium dihydrogen phosphate crystal, defect, photoluminescence PACS: 42.70.Mp, 61.72.-y, 78.55.-m DOI: 10.7498/aps.69.20200482

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 51402173) and the Fundamental Research Funds for the Central Universities, China (Grant No. FRF-TP-15-099A1).

[†] Corresponding author. E-mail: jux@ustb.edu.cn